

Анализ изотопного состава продуктов взрыва мишени, осажденных на накопительном экране

Анализы изотопного состава накопительных экранов проводились масс-спектрометрическими методами. Результаты измерений показали, что большинство проанализированных микродоз вещества мишени осажденного на поверхности накопительных экранов, имеет измененное соотношение изотопов по сравнению с природным (Рис. 24, 25).

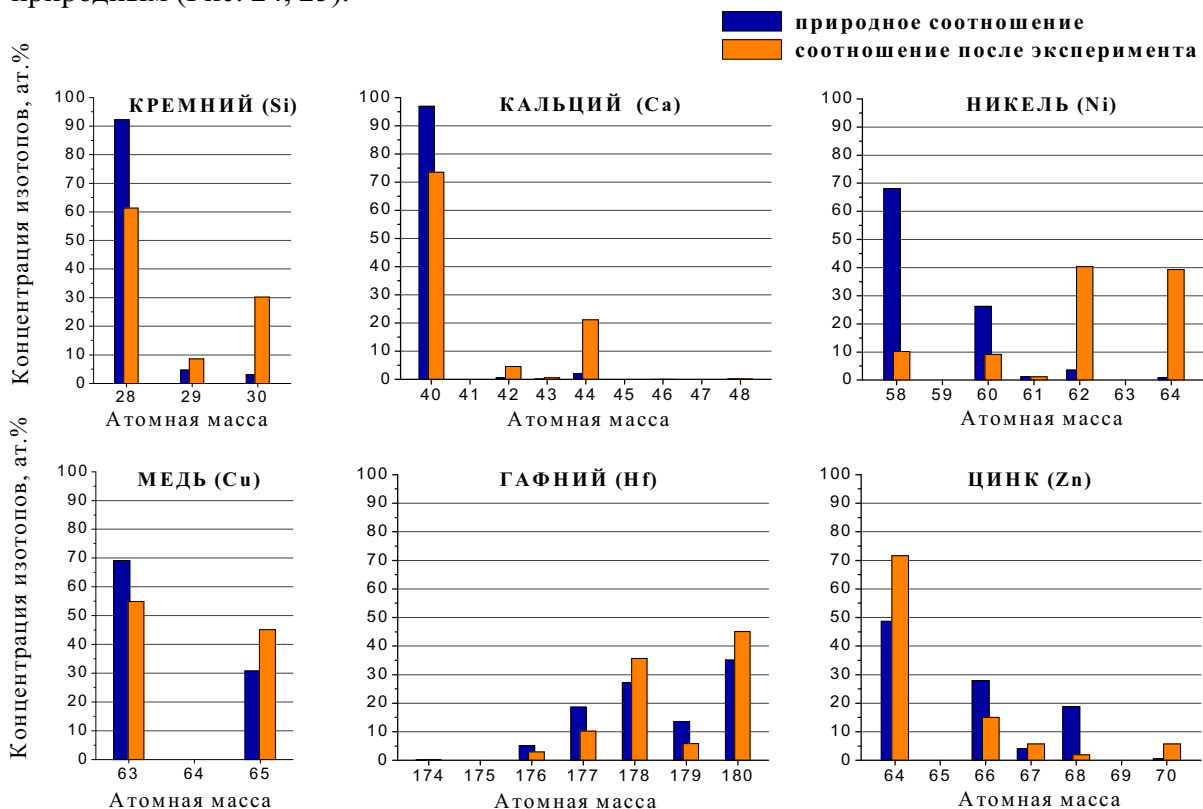


Рис. 24. Примеры аномальных соотношений изотопов, некоторых химических элементов, зарегистрированных на поверхности накопительных экранов. Метод исследования — вторичная ионная масс-спектрометрия (IMS-4f).

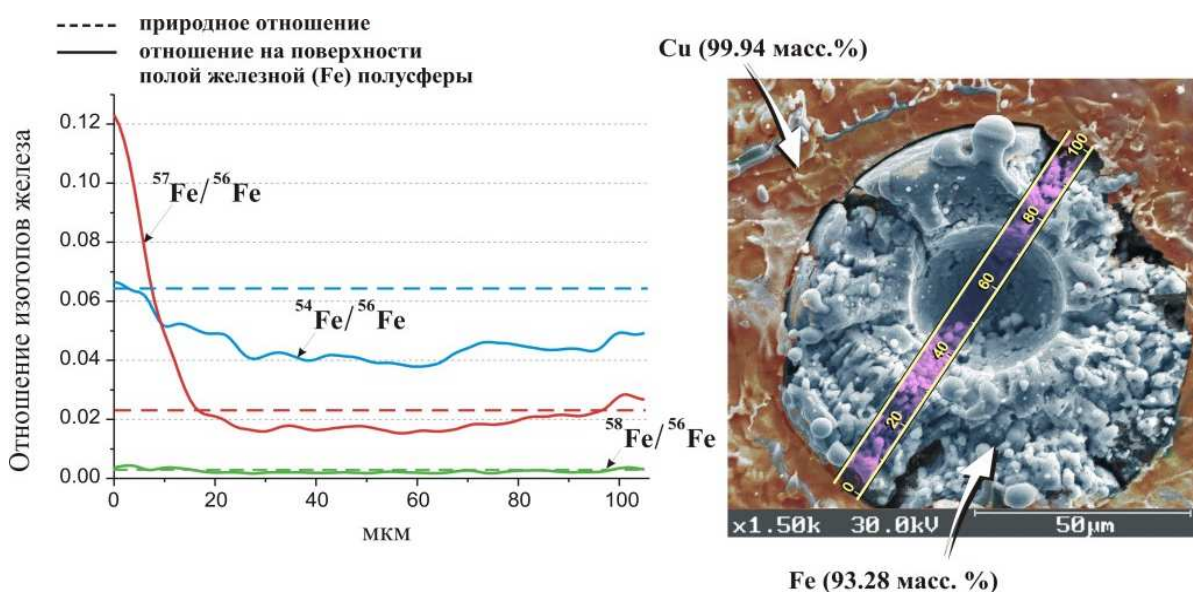


Рис. 25. Аномальное отношение изотопов железа на поверхности полой железной (Fe) полусферы, обнаруженной на поверхности медного накопительного экрана после эксперимента с медной мишенью. Метод исследования — вторичная ионная масс-спектрометрия (IMS-4f).